

リチウムイオン電池リサイクル材料への 蛍光X線分析法の適用

王 誼群*,高原 晃里*

使用済リチウムイオン電池(LIB)からレアメタル(Li, Ni, Co)の再資源化が重要であり、LIBリサイクル材料の組成分析の需要が高まっている.現在、LIBリサイクル材料の分析にはICP発光分析法がよく用いられているが、酸の使用や高度な処理技術が必要となるため、より簡便な分析手法が求められている.本稿では蛍光X線分析法を用いて、LIBリサイクル材料であるブラックパウダー(BP)およびブラックマス(BM)の組成分析を行い、ICP分析値との一致度を確認した.BP試料は散乱線FP法による残分推定モデルを用いることにより、ICP分析値とよく一致する分析結果を得た.不均質なBM試料は酸化処理およびガラスビード化の試料調製を行い、分析値の改善を確認した.

はじめに

近年、カーボンニュートラルの目標達成に向けた取 り組みの一つとして、電気自動車の開発が加速し、リ チウムイオン電池(LIB)の需要が著しく増加してい る. それに伴い、LIBに使用されるリチウム、ニッケ ル、コバルト(Li, Ni, Co)といったレアメタルのリサ イクルに関する規制が強化され、各国において取り組 みが活発化している.図1にLIBリサイクルの流れを 示す.処理メーカーに回収されたLIBは、破砕、選別、 焙焼などの処理を行った中間体を経て、レアメタルが 精錬、資源化され、再び電池製造プロセスに使用され る. 中間体には、正極工程廃材を破砕・選別して得ら れるブラックパウダー(BP)や、使用済のLIBを解体 し、熱処理後破砕・選別の処理工程を経て得られるブ ラックマス(BM)がある.BPやBMからレアメタルを 精錬する工程では、原料組成が厳しく管理されるた め、元素分析が重要となる。現在ICP発光分析がよく 用いられているが、BPやBMにはLIB構成材料に由来 する炭素や、遷移元素をはじめとした様々な成分が含 まれるため,酸分解を行う際に強酸の使用,処理条件 検討、廃液処理など安全性、ランニングコスト、時間 的コスト等の課題がある.

我々はより安全で簡便な元素分析手法として, 蛍光 X線分析法(XRF)による代替を検討してきた.本稿で は, BPやBMの組成分析に対する蛍光X線分析法の 適用性を評価し,より正確な分析値を得るための定量 分析方法や試料調製法を検討した.

*株式会社リガク プロダクト本部 アプリケーションラボ XRF分析グループ



図1. リチウムイオン電池リサイクルの流れ.

LIB リサイクル材料組成分析における蛍光X線分 析の課題

我々のグループは、これまでにスタンダードレスFP 分析法を用いてLIB正極材料および負極材料の組成分 析を行い,分析結果の有用性と妥当性について報告し た、スタンダードレスFP分析法は、定性分析で検出さ れた元素とそのX線強度、およびあらかじめソフトウェ アに登録されている感度ライブラリを用いて、FP法 (ファンダメンタル・パラメータ法)により定量計算を行 う方法である⁽¹⁾.検量線作成が不要なため.標準試料 の準備が難しい試料の分析に向いている. スタンダード レスFP法では、試料から発生した各元素の蛍光X線強 度が共存元素により受ける吸収・励起の影響を、物理 定数(ファンダメンタルパラメータ)を用いて理論計算す る. 正確な理論計算をするには試料中に含まれる全元 素の情報を把握することが重要であり、試料情報とし て金属か酸化物かの種別や、ポリマーやオイルなどの 場合は非測定成分の設定(計算モデル)が必要となる.



図2. BM粉体試料(試料1)のX線CT画像. コントラストから赤丸で囲った部分は金属破片と推察される 高分解能X線顕微鏡nano3DX(リガク製)にて撮影

NCM 三元系正極活物質(LiMO₂; M=Ni, Co, Mn)の 組成分析をスタンダードレスFP分析法で行う場合, 化合物形態を酸化物に設定した. XRF分析では原理 的に測定不可のLiは、他の分析手法で得られた含有 率,または化学組成から求められる含有率を固定値と して設定した. このような計算モデルを設定すること により、Ni, Co, Mnの含有率やモル比を正確に分析で きた⁽²⁾.しかし同方法は、組成が不明確で不均質な試 料も存在するLIBリサイクル材料に適用しても安定し て正確な分析値を得ることができなかった. 正極活物 質とLIBリサイクル材料の成り立ちの違いから、下記 二つの課題があると考え各種検討を行った. 課題 (1):BPやBMは正極活物質と異なり、リチウムの含 有率情報が得られにくく、かつ試料中にバインダーや 負極活物質に由来する炭素を多く含有すること. 課題 (2):BM 試料では集電箔や電池外装に由来する Al, Cu, Feといった金属成分が混在し不均質な状態であ り、粉砕による改善が困難であること(3),(4).例として、 本分析で使用したBM粉体試料のX線CT撮影写真を 図2に示す. 試料中に金属成分と思われる破片が多数 混在しており、非常に不均質であることがわかった.

課題(1)に対してはBPやBMに適したスタンダード レスFP法の計算モデルおよび残分設定を検討した. 図3にスタンダードレスFP法の計算モデルと適用試料 例を示す.金属試料では分析線の測定強度だけから組 成を決定できるが、ポリマーのような試料では、試料 の軽元素成分を残分として設定するモデル(残分設定 モデル)が良く用いられる.これは炭素のような軽元素 は分析深さが極めて浅く、試料の表面状態や不均質性 の影響を受けやすいため、炭素の測定強度を用いるよ りも、残分設定モデルの方が良好な分析結果が得られ



図3. スタンダードレスFP法の計算モデルと適用試料例.

やすいためである.例えば黒鉛負極材料中の不純物成 分を分析する際には、炭素を残分と設定している⁽²⁾. また、残分が設定しにくい試料の分析には、散乱線FP 法が有効である⁽⁵⁾.散乱線FP法では散乱線強度を用い て、酸素以下の超軽元素成分の影響を推定し、汚泥や スケールなど非測定成分を含む試料に対し、非測定成 分の影響を考慮した分析が可能である.LIBリサイク ル材料BPとBMには炭素が多く含まれているため、ま ず炭素を残分として設定した計算モデル(①C残分モ デル)を検討した.また炭素だけでなくリチウムも一定 量含有することから、散乱線FP法を用いて残分を推定 するモデル(②残分推定モデル)も検討し、それらの蛍 光X線分析値をICP分析値と比較した.

課題(2)に対しては試料のガラスビード化を検討した.ガラスビード法とは,粉体試料をアルカリ融剤とともに溶融し,ガラス化させる試料調製手法である. ガラスビード処理により粉砕では取り除けない粒度効 果や鉱物効果を低減することができる^{(6),(7)}.BMのような炭素や金属を多く含む試料は,溶融時に均質にガ ラス化せず,また白金るつぼと合金化反応を起こす可 能性があるため,ガラスビード化の前に試料の酸化処 理を行う手法を検討した.

2. 実験

2.1 試料調製方法

入手した BP 試料5 点および BM 試料3 点は、ミキ サーミルを用いて2分間粉砕した.その後平板型ダイ スと塩ビリングを用いて、電動プレス機で100 kNの 圧力で加圧成形した.

BM 試料は図4に示すフローで酸化処理とガラス ビード化を実施した.BM 試料に塩酸と硝酸を加え, 加熱しながら試料中に存在する金属成分を溶解させ た.その後,BM 溶解液にセルロースパウダーを加え, 固形物試料として回収した.さらに850℃の電気炉に 入れ,加熱することにより全成分を酸化物化させた. 酸化処理したBM 試料と四ホウ酸リチウム融剤(富士 フイルム和光純薬)を1:20の割合で混合し,卓上型高 周波ビードサンプラを用い1150℃で7分間溶融してガ



図4. BM 試料の酸化処理及びガラスビード化処理フロー.

ラスビード試料を作製した.

2.2 蛍光X線分析条件

調製されたBPとBMは、リガク製波長分散型蛍光 X線分析装置ZSX PrimusIVを用いて、真空雰囲気に て測定径20 mmで測定を行った。各試料において、 F~Cmまでの全定性分析を行い、得られた結果を用 いてスタンダードレスFP分析を行った。

スタンダードレスFP分析の計算モデルについて, ①C残分モデルでは検出された成分の化合物形態を酸 化物とし,残分は炭素と設定した. ②残分推定モデル では散乱線FP法を用いて,検出された成分を単体元 素とし,残分は推定するように設定した.

3. 結果

BP粉体試料の定量分析方法:FP計算モデル (残分)の検討結果

粉砕,加圧成形したBP試料5点についてF~Cmの 全定性分析を行い,スタンダードレスFP分析を行っ た.主成分であるNi,CoのほかにAl,Fなどの成分が検 出された(3.3節に分析結果の詳細を示す).ここでの検 討では,レアメタルであるNiとCoに着目することとし た.FP計算モデルの検討は残分を炭素と仮定した①C 残分モデル,および散乱線FP法を用いた②残分推定モ デルの2パターンで実施した.得られたNiとCoの分析 結果とICP分析値との比較を表1に示す.①C残分モ デルでは,XRF分析値はICP分析値とおおよその相関 があるものの,誤差が大きい試料も確認された.一方, ②残分推定モデルで得られたXRF分析値は,広い含有 率範囲においてICP分析値と良く一致した.

図5にBP試料のXRF分析値とICP分析値との一致度 をFP計算モデルごとに比較したグラフを示す.各試料に 対して得られたXRF分析値のICP分析値に対する割合を 算出した.100%からの差分は相対誤差の大きさを示し ている.①C残分モデルでは、NiとCo成分のXRF分析 値とICP分析値との相対誤差が20%~30%ほどあった が、②残分推定モデルでは2成分とも相対誤差が約10% 以内に収まった.BP試料中にはリチウムも存在すること から、残分を炭素と仮定する試料モデルでは不十分であ ると考えられる.散乱線FP法による残分推定モデルで は、散乱線強度を用いて酸素より原子番号の小さい成分 の平均原子番号と合計含有率を推定できるため、より正 確にNiやCo成分の含有率を分析できたと考えられる.

表1. BP 試料中NiとCo成分のXRF 分析結果. 単位:mass%

#		Ni	Со
	ICP	16.9	5.6
1	C残分	12.6	4.3
	残分推定	17.2	5.9
	ICP	43.5	5.6
2	C残分	39.5	5.3
	残分推定	43.9	5.9
	ICP	52.2	2.4
3	C残分	34.7	1.7
	残分推定	55.0	2.7
	ICP	21.7	7.5
4	C残分	16.4	5.7
	残分推定	22.7	7.8
	ICP	50.1	3.5
5	C残分	35.6	2.6
	残分推定	52.4	3.8



図5. BP 試料中NiとCo成分のXRF分析値とICP分析値との一致度: (a) C残分モデル, (b) 残分推定モデル.

3.2 BM 試料の定量分析方法:粉体試料とガラス ビードの検討結果

BM 試料ではレアメタルNi, Coのほかに、リサイク ル処理工程において重要な管理元素であるAlとCuに も着目し、XRF 分析値とICP 分析値との一致度を評価 した.また、ICP 値との比較は粉砕・加圧成形した BM 粉体試料とガラスビード化した BM ガラスビード 試料の双方で実施した.表2に各分析結果を示す.

図6(a)にBM粉体試料の残分推定モデルによるXRF 分析値とICP分析値との一致度を比較したグラフを示 す.BP粉体試料では残分推定モデルを用いることに よりICP分析値との一致が見られたが、BM粉体試料 では一致せず、どの元素もICP分析値と数10%の相対 誤差があった.また相対誤差の大きさは試料や元素ご とに異なり、AlとCuの相対誤差が大きく、Al分析値 は過大、Cu分析値は過少となる傾向が見られた. BM 粉体試料においては、散乱線FP法による残分推定モ デルでも正確な分析値が得られないことがわかった. BM試料は正極のみでなく電池構成材料がリサイクル 原料に含まれる、そのため、合金化した金属、複合化 合物, グラファイトなどが共存し, BP 試料より不均 質であると考えられる. FP法は試料を均質な状態と 仮定して定量計算するため、不均質性は分析誤差の要 因となる.

図6(b)にBM ガラスビード試料のXRF分析値とICP

				里位:	mass%
#		Ni	Co	Al	Cu
	ICP	6.36	31.3	15.2	8.68
1	粉体(残分推定)	5.17	32.8	32.2	5.55
	ガラスビード	6.45	31.0	12.1	7.34
	ICP	17.2	17.7	8.5	4.41
2	粉体(残分推定)	17.4	16.7	15.7	2.66
	ガラスビード	19.7	20.3	7.7	4.83

26.9

29.1

26.0

18.8

10.2

20.8

14.5

14.2

12.7

2.54

0.54

2.50

ICP

粉体(残分推定)

ガラスビード

3

表2. BM 試料中Ni, Co, Al, Cu成分のXRF分析結果.

分析値との一致度を比較したグラフを示す.BM粉体 試料と比べ、ガラスビード試料では各成分のXRF分 析値はICP分析値と概ね一致し、ICP分析値との相対 誤差が20%以内に収まった.特にAlとCuの分析値が 大きく改善された.このことは、BM粉体試料中に金 属破片や合金化物として存在したAlやCuが、一連の 試料処理により溶解、酸化され、ガラスビードとして 均質化されたためだと考えられる.

3.3 BP, BM 試料の微量成分含めた全定性分析結果

BPとBMからレアメタルを抽出する精錬工程を精 度よく実施するためには、Li, Ni, Coだけではなく、 Al, Fe, Cu, F, Pなどの組成を把握することが重要であ る.特に電解液中の六フッ化リン酸リチウム塩 (LiPF₆)やポリフッ化ビニリデン(PVDF)バインダーに 由来するフッ素成分は加熱で有害ガスフッ酸(HF)を 生成する危険性があるため、含有量を把握する必要が ある.ここまでBPとBMの主要成分の定量分析方法 の検討結果について述べたが、微量元素を含むF~ Cmの全定性分析結果について説明する.BP粉体試料 は残分推定モデルで、BMについてはガラスビード試 料のスタンダードレスFP分析結果を示す.

図7にBP粉体試料1の定性スペクトルを示す.Ni, Co, Mn, Alの大きなピークが検出された.BPは主に正 極工程廃材から得られるため,Ni, Co, Mnは正極活物 質,Alは正極集電箔に由来するものと考えられる. スペクトルには微小なTi, Fe, Sr, Zr, Wのピークが検出 された.これらの元素は、電池性能やサイクル特性改 善のために,正極材料に添加される添加剤やコーティ ング剤に起因する成分由来の可能性がある.また、リ サイクル工程で混入した異物や不純物に起因する可能 性も考えられる.Feの検出に関しては、Fe-Kaが主成 分MnのMn-Kβとエネルギーが近く、エネルギー分散 型蛍光X線分析装置では分離が困難であるが、本分析 で用いた波長分散型蛍光X線分析装置は、角度分解能 が優れるため明瞭に確認された.さらにFのピークも 検出され、PVDFバインダーに起因すると推察した.

図8にBMガラスビード試料1の定性スペクトルを示 す.BP試料と異なり,BM試料の重元素領域(図8(a)) のチャートにはNi,Co,Mn以外に,FeとCuの大きな



図6. BM 試料中Ni, Co, Al, Cu成分のXRF分析値とICP分析値との一致度: (a) 粉体, (b) ガラスビード.



ピークが確認された. Ni, CoとMn は正極活物質に由 来し, FeとCuは電池外装や負極集電箔に由来するも のと推察した. さらにTi, Cr, Zn, Zr, Wに帰属される ピークが検出された. BM 試料は使用済LIBを解体, 焙焼して得られたものであり,主として正極のみから なる BP 試料よりも多くの成分が含まれることがわ かった. その他にA1とPに帰属されるピークが確認 された. Alは電池外装や集電箔に起因し, PはLiPF₆ 電解質成分に起因するものと推察した. さらにリサイ クル工程で混入したと思われる, ICP発光分析では分 析困難なSi成分も検出することができた.

表3にBP粉体試料5点のスタンダードレスFP分析 結果(残分推定モデル)を示す.同じBP試料分類でも, レアメタルのNi, Co成分の含有率はそれぞれ10~

リチウムイオン電池リサイクル材料への蛍光 X 線分析法の適用

#	Ni (mass%)	Co (mass%)	Mn (mass%)	Al (mass%)	Cu (mass%)	Fe (ppm)	F (mass%)	P (ppm)	Si (ppm)
1	17.2	5.9	7.0	4.4	N.D.	458	2.6	14	225
2	43.9	5.9	9.4	0.4	N.D.	216	1.6	N.D.	97
3	55.0	2.7	0.1	1.8	N.D.	428	N.D.	22	151
4	22.7	7.8	9.2	0.1	N.D.	431	(0.5)	23	147
5	52.4	3.8	2.0	0.6	1.4	1027	N.D.	6451	375
#	Na (ppm)	Mg (ppm)	S (ppm)	Ti (ppm)	Cr (ppm)	Sr (ppm)	Zr (nnm)	Ba (ppm)	W (ppm)
1	701					(hhm)	(PP)		(FF)
	/01	N.D.	1628	427	N.D.	113	798	N.D.	1053
2	(217)	N.D. N.D.	1628 562	427 N.D.	N.D. N.D.	113 200	798 1391	N.D. N.D.	1053 1027
2 3	(217) N.D.	N.D. N.D. 347	1628 562 143	427 N.D. N.D.	N.D. N.D. N.D.	113 200 N.D.	798 1391 174	N.D. N.D. N.D.	1053 1027 1662
2 3 4	(217) N.D. 563	N.D. N.D. 347 N.D.	1628 562 143 886	427 N.D. N.D. N.D.	N.D. N.D. N.D. N.D.	113 200 N.D. N.D.	798 1391 174 2292	N.D. N.D. N.D. N.D.	1053 1027 1662 N.D.

表3. BP粉体試料5点のスタンダードレスFP分析結果(残分推定モデル)

※N.D.: 検出下限值(LLD)以下

検出下限値:バックグラウンド強度の統計変動の3倍(3σ)

※()内の分析値は定量下限値以下

定量下限値:バックグラウンド強度の統計変動の9倍(9の)

表4. BM ガラスビード試料3点のスタンダードレスFP分析結果.

#	Ni (mass%)	Co (mass%)	Mn (mass%)	Al (mass%)	Cu (mass%)	Fe (mass%)	P (mass%)	Si (mass%)	Na (ppm)	Mg (ppm)
1	6.5	31.0	4.6	12.1	7.3	1.8	0.5	0.4	(851)	1263
2	19.7	20.3	10.2	7.7	4.8	4.9	0.5	0.7	(942)	1542
3	26.0	20.8	0.6	12.7	2.5	0.9	0.1	0.6	(1996)	1272
#	S (ppm)	Ті (ррт)	Cr (ppm)	Zn (ppm)	Zr (ppm)	Мо (ррт)	Sn (ppm)	W (ррт)	La (ppm)	
#	S (ppm) 896	Ti (ppm) 3100	Cr (ppm) 833	Zn (ppm) 454	Zr (ppm) 1115	Mo (ppm) N.D.	Sn (ppm) N.D.	W (ppm) (825)	La (ppm) N.D.	
# 1 2	S (ppm) 896 533	Ti (ppm) 3100 N.D.	Cr (ppm) 833 1101	Zn (ppm) 454 915	Zr (ppm) 1115 317	Mo (ppm) N.D. N.D.	Sn (ppm) N.D. 202	W (ppm) (825) N.D.	La (ppm) N.D. N.D.	

※ N.D.: 検出下限值 (LLD) 以下

検出下限値:バックグラウンド強度の統計変動の3倍(3σ)

※()内の分析値は定量下限値以下

定量下限値:バックグラウンド強度の統計変動の9倍(9σ)

60%, 2~6%と, 試料により異なることがわかった. 電極の構成成分として着目されるAl, Cu, Fe, F, P, Siの ほかに, 正極添加剤成分やリサイクル工程で混入した と考えられる~2000 ppm レベルの少量成分が検出さ れた.

表4にBMガラスビード試料3点のスタンダードレスFP分析結果を示す.BM試料はBP試料と比べAl, Cu,Feの含有率が高く,これはリサイクル原料に集 電箔や電池外装が多く含まれるためであると考えられる.その他の少量成分もBPに比べ増加し,特にCr, Zn, Mo, Sn, Laの重元素が200~7000 ppmと多く検出 された.

4. まとめ

本稿では、蛍光X線分析法を用いてLIBリサイクル 材料であるBPやBMの組成分析を行い、レアメタル (Ni, Co)および不純物成分(Al, Cu)についてICP分析 値との一致度を調べた.スタンダードレスFP分析法 の定量計算モデルおよび試料調製方法を検討し、LIB リサイクル材料における蛍光X線分析法の適用性を評 価した.

BP試料の分析には散乱線FP法による残分推定モデ ルが有効であることを示した.一方,BM試料は粉体 のままでは残分推定モデルにおいてもICP分析値と一 致せず,分析誤差の低減には酸化処理およびガラス ビード化の試料調製が必要であった.この試料調製方 法は手間がかかるが,ICP分析が準備できない場合な どに適用可能であると考えられる.また,本稿で用い たBM試料には金属片が多く含まれており,不均質性 の非常に高い試料であったため複雑な試料処理が必要 となったが,処理工程の違いによりある程度均質なも のも多く,BPと同様に加圧成形試料で残分推定モデ ルが適用できる場合もある.

市場の規模が増大し続けるLIBリサイクル業界において、蛍光X線分析が有効な組成分析手法として活用されるように、検量線法、より簡便な試料調製法、および 機械学習の利用など多角的に今後も検討を継続する.

参考文献

- 山田康治郎: ZSX Guidanceの進化した半定量 分析(SQX分析),リガクジャーナル 50 (2019), No. 1, 16-20.
- (2) 高原晃里、小林弘典:リチウムイオン電池材料のスタンダードレスFP蛍光X線分析、リガクジャーナル52 (2021)、No. 1, 6–11.
- (3) 小松浩平,境健一郎,飯野智之:廃棄物資源循 環学会誌,33(2022),196–203.
- (4) A. Vanderbruggen, E. Gugala, R. Blannin, K. Bachmann, R. Serna-Guerrero, M. Rudolph: Miner. Eng., 169 (2021), 106924.
- (5) アプリケーションノートXRF1036, Supermini200/
 残分推定機能を持つSQX散乱線FP法によるスクリーニング分析,株式会社リガク.
- (6)渡辺充:蛍光X線分析法における試料調製第 4回ガラスビード基礎編、リガクジャーナル 45(2014), No. 2, 19–24.
- (7)渡辺充:蛍光X線分析法における試料調製第
 5回ガラスビード応用編,リガクジャーナル 46(2015), No. 1, 14–18.